## Электрические и термоэлектрические свойства *p*-Ag<sub>2</sub>Te

© Ф.Ф. Алиев<sup>¶</sup>, Э.М. Керимова, С.А. Алиев

Институт физики Академии наук Азербайджана, 370143 Баку, Азербайджан

(Получена 26 ноября 1999 г. Принята к печати 25 января 2002 г.)

Исследованы температурные зависимости коэффициента Холла R, электропроводности  $\sigma$  и термоэдс  $\alpha_0$  в интервале температур 4–300 К. Наблюдаемые особенности на температурных зависимостях R(T),  $\sigma(T)$  и  $\alpha_0(T)$  интерпретированы в рамках модели с двумя типами носителей тока.

Исследованию электрических и термоэлектрических свойств теллурида серебра посвящено много работ [1–8]. Авторы показали, что закон дисперсии электронов в n-Ag<sub>2</sub>Te подчиняется кейновской модели [1,2]. В интервале 4–300 K основными механизмами рассеяния носителей тока являются рассеяния на ионизированных примесях и оптических фононах [1–4].

В отличие от n-Ag<sub>2</sub>Te электрические и термоэлектрические свойства в p-Ag<sub>2</sub>Te имеют особенности, которые не наблюдаются в n-Ag<sub>2</sub>Te. Их анализ требует более точного знания свойств носителей заряда в p-Ag<sub>2</sub>Te. Несмотря на ряд работ, посвященных этому вопросу в p-Ag<sub>2</sub>Te [4–8], задачу нельзя считать решенной.

Данная работа посвящена исследованию температурных зависимостей коэффициента Холла R(T), проводимости  $\sigma(T)$  и термоэдс  $\alpha_0(T)$  с целью установления ряда свойств носителей заряда в p-Ag<sub>2</sub>Te.

#### Экспериментальные данные

Образцы *p*-Ag<sub>2</sub>Te были получены по единой технологии [9] с избытком Te до ~ 1 ат% [10]. Однородность в твердом состоянии изучена диламетрическим методом [9]. Для измерения образцы изготовлялись в виде параллелепипедов размерами  $2 \times 3 \times 10$  мм. Полученные экспериментальные данные по температурным зависимостям кинетических коэффициентов R(T),  $\sigma(T)$ и  $\alpha_0(T)$  представлены на рис. 1.

Температурная зависимость коэффициента Холла R(T) представлена кривой I на рис. 1. Видно, что R(T) до  $T \approx 45$  К не зависит от T, затем уменьшается с ростом температуры и при  $T \approx 65$  К изменяет знак на отрицательный, достигая максимума по модулю |R| при  $T \approx 80$  К, затем |R|(T) плавно уменьшается, и в интервале температур 200–300 К падение |R| замедляется. Там же кривой 2 показана температурная зависимость проводимости  $\sigma$ . Из сравнения  $\sigma(T)$  и R(T) видно, что  $\sigma(T)$  при  $T \approx 65$  К, соответствующей температуре инверсии знака R, проходит через минимум, далее с ростом температуры увеличивается и при  $T \approx 200$  К проходит через максимум. Кривой 3 на рис. 1 показана температурная зависимость термоэдс  $\alpha_0(T)$ , которая линейно растет до

 $T \lesssim 45$  K, а затем изменяет знак. При  $T \approx 80$  и 270 K проявляются максимумы зависимости  $|\alpha_0(T)|$ .

#### Обсуждение полученных данных

Температурные зависимости  $\sigma(T)$ , R(T) и  $\alpha_0(T)$  в *p*-Ag<sub>2</sub>Te обсуждались в работах [5–8]. Авторы [5] пытались объяснить наблюдаемые плато на зависимости R(T) в области  $T \simeq 230-300$  К. Из наклона R(T)(при  $T \gtrsim 80$  К) авторы оценили энергию активации  $0.04 \pm 0.01$  эВ, предполагая, что в запрещенной зоне возникают локальные энергетические уровни. Наличие плато на R(T) обусловливается истощением этих энергетических уровней [5]. Авторы [6] сделали вывод, что в области собственной проводимости в *p*-Ag<sub>2</sub>Te концентрация носителей заряда подчиняется степенной зависимости  $n_i \propto T^3$ , соответствующей активации носителей заряда между зонами с сильно непараболитическим энергетическим спектром электронов и дырок. По мнению авторов [6], резкое замедление роста кон-



**Рис. 1.** Температурные зависимости коэффициента Холла R(1) при H = 12 кЭ, электропроводности  $\sigma(2)$  и термоэдс  $\alpha_0(3)$ . Сплошные линии — расчет.

<sup>¶</sup> E-mail: physic@physics.ab.az

центрации электронов (появление плато на R(T)) в интервале температур ~ 250–300 К объясняется наличием дополнительной валентной зоны с большой плотностью состояний.

Авторы [7] предположили, что наличие максимума проводимости и некоторые аномалии термоэдс в области  $T \simeq 248-283$  К могут быть связаны с возможным фазовым переходом. Падение величины  $|\alpha_0|$  при T > 283 К более характерно для примесной проводимости, а рост  $|\alpha_0|$  с понижением температуры связан с изменением механизма рассеяния и фононным увлечением носителей заряда. Авторы [8] показали, что в температурной области 140-200 К величина  $\alpha_0(T)$  изменяется по закону  $|\alpha_0| \propto T^3$ , и в этом интервале температур происходит увлечение носителей заряда фононами.

Авторы [5–8], при отсутствии низкотемпературных исследований R,  $\sigma$ ,  $\alpha_0$  и не учитывая температурной зависимости зонных параметров, сделали, на наш взгляд, необоснованные выводы. Для выяснения данного вопроса должен быть проведен комплексный анализ температурных зависимостей  $\sigma(T)$ , R(T),  $\alpha_0(T)$  с учетом закона дисперсии электронного спектра и механизмов рассеяния.

Такой анализ проведен следующим образом.

Экспериментальные данные (рис. 1) свидетельствуют о том, что при низких температурах дырочный газ вырожден при  $T \leq 50$  К. Коэффициент Холла R и проводимость  $\sigma$  не зависят от температуры, а зависимость термоэдс от температуры  $\alpha_0(T)$  — линейна. Действительно, известно, что термоэдс  $\alpha_0$  при любой степени вырождения газа носителей заряда, при стандартной зоне, определяется следующим образом [11]:

$$\alpha_0 = -\frac{k_0}{e} \left[ \frac{\mathbf{F}_{r+2}(\mu^*)}{\mathbf{F}_{r+1}(\mu^*)} - \mu^* \right],\tag{1}$$

где  $\mu$  — уровень Ферми,  $\mu^* = \mu/k_0 T$ ,  $F_r(\mu^*)$  — интеграл Ферми, определенный в [11]:

$$\mathbf{F}_r = \int_0^\infty \left( -\frac{\partial f_0}{\partial x} \right) x^r dx,$$

 $x = \varepsilon/k_0 T$ , индекс *r* определяется  $\tau(\varepsilon)$  — зависимостью времени релаксации импульса носителей заряда от энергии  $\varepsilon$ :

$$\tau(\varepsilon) = \tau_{0r}(T) \left(\frac{\varepsilon}{k_0 T}\right)^{r-1/2}; \qquad (2)$$

 $r = r_{\rm ak} = 0$  для рассеяния на акустических фононах,  $r = r_{\rm i} = 2$  для рассеяния на ионах примеси. Из формулы (1) при  $\mu^* \gtrsim 10$  получаем  $\alpha_0 \propto T$ .

Используя значение эффективной массы дырок  $m_p = 0.12m_0$  [3] и полагая, что концентрация доноров  $N_d = 0$ , из значения коэффициента Холла R при T < 50 К находим концентрацию акцепторов  $N_a = 6.25 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup> и температуру снятия вырождения дырочного газа  $T_{hd} \approx 56$  К.

При  $T \gtrsim 60$  К снимается вырождение дырок и начинается собственная проводимость, о чем свидетельствуют экспериментальные данные, приведенные на рис. 1. Используя температурную зависимость ширины запрещенной зоны в Ag<sub>2</sub>Te [12,13]

$$E_g(T) = (0.035 - 7 \cdot 10^{-5}T)$$
 sB,

из уравнения нейтральности  $N_a = p - n$  в области собственной проводимости можно сделать оценку и показать: собственная концентрация электронов  $n_i$  приблизительно при  $T \gtrsim 200$  К возрастает настолько, что начинается вырождение электронного газа, что характерно для узкозонных полупроводников. Такая оценка подтверждается температурными зависимостями R(T),  $\sigma(T)$  и  $\alpha(T)$  при  $T \gtrsim 200$  К.

В области собственной проводимости для двух типов носителей тока величины R(T),  $\sigma(T)$  и  $\alpha_0(T)$  в слабом магнитном поле H при  $(U_pH)^2 \ll 1$ ,  $(U_nH)^2 \ll 1$ , где  $U_p$ ,  $U_n$  — подвижности дырок и электронов, определяются по следующим формулам [14]:

$$R = \frac{1}{N_a e} \frac{(1-c)(1-b^2 c)}{(1+bc)^2},$$
(3)

$$\sigma = N_a e U_n \frac{1+bc}{b(1-c)},\tag{4}$$

$$\alpha_0 = \frac{\alpha_{0p}\sigma_p - \alpha_{0n}\sigma_n}{\sigma_p + \sigma_n},\tag{5}$$

где  $N_a = p(1-c)$  — концентрация акцепторов,  $b = U_n/U_p$  — отношение подвижностей электронов и дырок; c = n/p — отношение концентраций электронов *n* и дырок *p*;  $\sigma_p$ ,  $\sigma_n$ ,  $\alpha_{0p}$  и  $\alpha_{0n}$  — электропроводности и термоэдс дырок и электронов соответственно.

Перейдем к определению отношения подвижностей b(T). При инверсии знака коэффициента Холла R отношение подвижностей составляет  $b = 1/c^2$ , а при минимуме  $|R(T)| = |R_{\min}|$  ( $T \approx 80$  K), b = 1/c [14],

$$|R_{\min}| = \frac{(1-b)^2}{4beN_a}.$$

Выше  $T \approx 80 \,\mathrm{K}$  величина *b* подбиралась так, чтобы вычисленные значения *R* совпадали с экспериментальными данными (см. рис. 1, кривая *I* и рис. 2). Зависимость c(T) рассчитывалась по соотношению

$$c = \frac{n_i}{N_a + p_i}.$$

Если известны b(T) и c(T), то с помощью соотношений (3)-(5) и по данным  $\sigma(T)$  (рис. 1, кривая 2) можно определить зависимости  $U_n(T)$  и  $U_p(T) = U_n(T)/b(T)$  (рис. 3).

Расчетные температурные зависимости подвижности электронов при  $T > 50 \,\mathrm{K}$ , когда электронный вклад в кинетические коэффициенты начинает становиться заметным на фоне дырочной проводимости (рис. 1),



**Рис. 2.** Температурные зависимости отношения подвижностей электронов и дырок  $b = U_n/U_p$  и отношения концентрации электронов и дырок  $c = n_i/(N_a + p_i)$ .



**Рис. 3.** Температурные зависимости подвижностей электронов  $U_n$  и дырок  $U_p$ , определенные по экспериментальным данным с помощью формул (3)–(5). Расчетные зависимости для подвижности электронев:  $U'_{0n}$  — для невырожденного электронного газа (ЭГ),  $U''_{0n}$  — для вырожденного ЭГ и параболической зоны,  $U''_{n}$  — для вырожденного ЭГ и непараболической зоны (10)–(12).

определялись для случаев: невырожденного электронного газа (при *T* < 200 K) и при его вырождении — как для стандартной (параболической) зоны проводимости, так и непараболической (при *T* > 200 K). Температурная зависимость подвижности имеет вид

$$U(T) = \frac{e\langle \tau_{\rm eff}(T,\varepsilon)\rangle}{m^*},\tag{6}$$

где  $\tau_{\rm eff}$  — время релаксации импульса,  $m^*$  — эффективная масса носителей тока, угловыми скобками обозначено усреднение по энергии электронов. При существовании двух механизмов рассеяния с параметрами  $r_i$  и  $r_{ak}$ , эффективное транспортное время релаксаций рассчитывается при использовании представления  $\tau(\varepsilon)$  в виде (2) [11]:

$$\tau_{\rm eff}(T,\varepsilon) = \frac{\tau_{\rm 0i}(T)\tau_{\rm 0ak}(T)\left(\frac{\varepsilon}{k_0T}\right)^{r_{\rm ak}-1/2}}{\tau_{\rm 0i}(T) + \tau_{\rm 0ak}(T)\left(\frac{\varepsilon}{k_0T}\right)^{r_{\rm ak}-r_{\rm i}}}.$$
 (7)

При определении  $\tau_{0i}(T)$  для рассеяния на ионизованных примесных атомах применима формула

$$\tau_{0i}(T) = \frac{\chi^2 (2m_n)^{1/2} (k_0 T)^{3/2}}{\pi e^4 N_i F},$$
(8)

где  $m_n = 0.025m_0$  [1],  $\chi = 16$  — диэлектрическая постоянная кристалла,  $N_i$  — концентрация ионов примеси;

$$F = \ln(1+\xi) - \frac{\xi}{1+\xi}; \quad \xi = 4k^2 r_S^2,$$

где *r<sub>s</sub>* — радиус экранирования, который для невырожденных полупроводников определяется как

$$r_S = \left(\frac{\chi k_0 T}{4\pi e^2 n}\right)^{1/2}$$

*n* — концентрация электронов, *k* — импульс электрона с энергией  $\varepsilon = \hbar^2 k^2 / 2m_n$ .

Формула для  $\tau_{0ak}(T)$  — температурного коэффициента в (2) при рассеянии электронов на деформационном потенциале акустических колебаний решетки при стандартной зоне имеет вид

$$\tau_{0ak}(T) = \frac{9\pi}{2} \frac{\rho U_0^2 \hbar^4}{C^2 (2m_n k_0 T)^{3/2}},\tag{9}$$

где  $\rho$  — плотность кристалла, C— константа и  $U_0$  — скорость звука в кристалле. В работе [15] было найдено, что величина C связана с константой деформационного потенциала решетки  $E_d$  следующим образом:  $E_d = \frac{2}{3}$ С. Учитывая значения  $\rho = 8.32 \,\mathrm{kr/cm^3}$  [9],  $U_0 = 5 \cdot 10^5 \,\mathrm{cm/c}$  [16] и приняв  $E_d = 10 \,\mathrm{sB}$ , можно рассчитать  $\tau_{0ak}(T)$ .

Подставляя (8) и (9) в (7), определим  $\tau_{\rm eff}(T) = \langle \tau_{\rm eff}(T, \varepsilon) \rangle$  при одновременном рассеянии электронов на ионизированных примесях и на акустических колебаниях решетки и с помощью соотношения (6) — температурную зависимость подвижности  $U'_{0n}$  для невырожденного электронного газа (рис. 3).

При учете

$$r_{S} = \left[\frac{\chi\hbar^{2}}{4m_{n}e^{2}}\left(\frac{\pi}{3n}\right)^{1/2}\right]^{1/2}$$

подобным образом можно рассчитать  $U_{0n}''$  (рис. 3) для случая вырожденного электронного газа.

Подвижность носителей тока при сильном вырождении и кейновском законе дисперсии при рассеянии на акустических фононах ( $r_{ak} = 0$ ) и на ионах примеси ( $r_i = 2$ ) выражается формулами [17]:

$$U_{\rm ak}'' = \left(\frac{\pi}{3}\right)^{1/3} \frac{e\rho U_0^2 \hbar^3 n^{-1/3}}{E_d k_0 T(m^*)^2} \frac{1}{f_{\rm ak}},\tag{10}$$

$$U_{\rm i}'' = \frac{3\pi^2 \hbar^3 \chi^2}{2em^*} \frac{1}{f_{\rm i}},\tag{11}$$

где  $f_k$  — факторы, учитывающие влияние непараболичности на вероятность рассеяния, которые вычисляются по следующим формулам [18]:

$$f_{ak}(P/P_0) = \frac{2.3}{12} - \frac{1}{20} \frac{P}{P_0} + \frac{10.3}{12} \left(\frac{P}{P_0}\right)^2,$$
  
$$f_i(P/P_0) = a - \frac{b'}{2} + \frac{1}{16}(b' + 3c') + \left[\frac{b'}{2} - \frac{1}{8}(b' + 3c')\right]$$
  
$$\times \left(\frac{P}{P_0}\right) + \frac{b' + 3c'}{16} \left(\frac{P}{P_0}\right)^2,$$

где

$$a = \ln\left(1 + \frac{1}{\xi'}\right) - \frac{1}{1 + \xi'}, \quad b' = 4 + \frac{4\xi'}{1 + \xi'} - 8\xi' \ln\left(1 + \frac{1}{\xi'}\right),$$
  

$$c' = 2 - 12\xi' + \frac{4\xi'}{1 + \xi'} + 12\xi'^2 \ln\left(1 + \frac{1}{\xi'}\right), \quad P = \left(\frac{m_0}{m^*} - 1\right),$$
  

$$P_0 = \left(\frac{m_0}{m_n} - 1\right), \quad \xi' = \frac{e^2m^*}{\pi\hbar^2\chi(3\pi n)^{1/3}} = \frac{1}{4k_{\rm F}^2 r_S^2}.$$

Здесь  $m^*$  и  $m_n$  — эффективные массы электрона на уровне Ферми и на дне зоны проводимости [1,2],  $k_F$  — квазиимпульс на уровне Ферми. Результаты расчета температурной зависимости подвижности для вырожденного электронного газа с учетом (10) и (11)

$$U_n''(T) = \left(\frac{1}{U_{ak}''} + \frac{1}{U_i''}\right)^{-1}$$
(12)

представлены на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что рассчитанные зависимости  $U'_{0n}(T)$  при  $T \leq 200$  К и  $U''_{0n}(T)$ ,  $U''_{n}(T)$  при  $T \gtrsim 200$  К качественно согласуются с зависимостью  $U_n(T)$ , определенной по формулам (3)–(5) и экспериментальным данным. Таким же образом определенная подвижность дырок  $U_p(T)$  при  $T \lesssim 50$  К не зависит от температуры, как и должно быть для сильно вырожденного дырочного газа при рассеянии на ионах примеси. При повышении температуры преобладает рассеяние дырок на фононах.

Сопоставление данных по  $U_n(T)$  с теоретическими расчетами показало, что расчетные значения подвижности электронов меньше экспериментальных. Это может быть связано с тем, что в Ag<sub>2</sub>Te значение радиуса экранирования близко к значению постоянной решетки.

Учитывая приведенные расчеты c(T), b(T) и  $U_n(T)$ , с помощью формул (3)–(5) рассчитаны зависимости R(T),  $\sigma(T)$  и  $\alpha_0(T)$ , которые представлены на рис. 1 сплошными линиями.

Итак, при  $T \lesssim 50$  К исследованный образец Ag<sub>2</sub>Te обладает дырочной проводимостью при сильном вырождении дырочного газа. Интервал температур  $50 \lesssim T \lesssim 200$  К соответствует области собственной проводимости и температурные зависимости кинетических коэффициентов R(T),  $\sigma(T)$  и  $\alpha_0(T)$  определяются двумя сортами носителей.

При T > 200 К основную роль в проводимости начинают играть электроны и с повышением температуры начинается все более сильное вырождение электронного газа. Соответственно знаки эффектов Холла и термоэдс соответствуют электронной проводимости (рис. 1). При этом коэффициент Холла R = 1/en и слабо изменяется с температурой. Зависимость  $\sigma(T)$  определяется температурной зависимостью подвижности электронов  $U_n(T) \propto T^{-1.2}$  при рассеянии на акустических фононах. В области 200 < T < 270 К зависимость термоэдс от температуры определяется выражением (1), если не учитывать непараболичность зоны проводимости. В этой области температур приведенный химический потенциал  $\mu^* = \mu/kT$  определяется быстрым возрастанием величины  $\mu > 0$ , отсчитываемой от дна зоны проводимости. В этих условиях формула (1) дает уменьшение величины  $|\alpha_0|$ . При достижении  $T = 270 \, \text{K}$  и достаточно сильного вырождения (величина  $\mu^* > 5$ ) значение химического потенциала µ с ростом температуры изменяется мало. В результате  $|\alpha_0(T)| \propto 1/\mu^* = kT/\mu$  [11], т.е. абсолютное значение термоэдс линейно возрастает с температурой, как и в области низкотемпературной дырочной проводимости.

Таким образом, выявлены причины уменьшения  $\sigma$ , зависимости R(T) и появление максимума  $|\alpha_0|$  в области температур  $\sim 200-300$  К.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенная модель с двумя типами носителей тока полностью описывает электрические и термоэлектрические свойства *p*-Ag<sub>2</sub>Te.

### Список литературы

- С.А. Алиев, У.Х. Суюнов, М.И. Алиев. ФТП, 7 (10), 2024 (1983).
- [2] С.А. Алиев, З.Ф. Агаев. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 19 (12), 2050 (1983).
- [3] С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 24 (2), 341 (1988).
- [4] С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев, С.Г. Абдинова, З.С. Гасанов, Д.М. Рагимова. Изв. вузов. Физика, № 6, 41 (1990).
- [5] В.В. Горбачев, И.М. Путилин. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 11 (9), 1556 (1975).
- [6] А.С. Королева, В.Ю. Мартынов, П.П. Петров. Тез. докл. 2-й Всес. конф. ЧГУ "Материаловедение халькогенидных кислородсодержащих полупроводников" (Черновцы, 1996) с. 47.
- [7] О.П. Астахов. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 10 (9), 1614 (1974).

- [8] В.П. Жузе, И.М. Цидильковский, Т.С. Бартницкая. ЖТФ, 8, 1646 (1958).
- [9] В.М. Глазов, Н.М. Махмудова. Изв. АН СССР. Неорг. матер., **6** (8), 1409 (1970).
- [10] С.А. Алиев, Ф.Ф. Алиев. Изв. АН СССР. Неорг. матер., 25 (2), 241 (1989).
- [11] Б.М. Аскеров. Кинетические эффекты в полупроводниках (Л., Наука, 1970).
- [12] Ф.Ф. Алиев. Изв. ИФАН Республики Азербайджан. Физика, 11 (4), 15 (1996).
- [13] F.F. Aliev. Proc. Second Int. Symp. on Mathematical and Computational Applications (Baku, 1999) p. 80.
- [14] К. Хилсум, А. Роуз-Инс. Полупроводники типа А<sup>III</sup>В<sup>V</sup> (М., ИЛ, 1963).
- [15] Г.Е. Пикус. ЖТФ, 28, 2390 (1958).
- [16] Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник (М., Наука, 1979).
- [17] Т.А. Алиев, Ф.М. Гашим-заде, С.А. Алиев, Т.Г. Гаджиев, М.Э. Алиев, М.И. Алиев. ФГП, 5 (2), 323 (1971).

Редактор Т.А. Полянская

# The energy spectrum of charge carriers in p-Ag<sub>2</sub>Te

F.F. Aliev, E.M. Kerimova, S.A. Aliev

Institute of Physics, Academy of Sciences of Azerbaijan, 370143 Baku, Azerbaijan

**Abstract** A study has been made of temperature dependencies of the Hall-coefficient *R*, electric conductivity  $\sigma$  and thermopower  $\alpha_0$  in *p*-Ag<sub>2</sub>Te within the temperature range 4–300 K. Observed are the following features: reduction of R(T) within the temperature range 200–300 K, the minimum at ~ 65 K and the maximum at ~ 200 K in  $\sigma(T)$  and also maxima in  $\alpha_0(T)$  at ~ 80 and 270 K. Obtained experimental data are analyzed within the framework of the two types of carriers model.